Se	earch Notes	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/801,221	CHEN ET AL.	
Examiner	Art Unit	_
Jean A. Gelin	2617	

,	SEAR	CHED		
Class	Subclass	Date	Examiner	
455	437 442 435.2 435.3	11/15/2004	JG	
	436 438 439			
	423 518	į		
	519 522 527			
	66.11			
	67.16			
370	331 332 328			
		•	•	
<u> </u>			···	

INT	ERFERENC	E SEARCH	ED
Class	Subclass	Date	Examiner

			DATE	EXMR
		•		
	·			
,				
		_		
		į		
•	÷			
				,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				